

用X射线荧光分析技术测定镀、包金层的厚度

@邓艳丽@李卫华@刘宝生@刘际时\$中国原子能科学研究院核技术应用研究所

收稿日期 修回日期 网络版发布日期:

摘要 把X射线荧光分析和低能 γ 射线散射技术相结合,准确地测量了镀、包金制品的镀、包金层厚度。可测定的最大镀、包层厚度为70 μm ,测量准确度好于10%。

关键词 [X射线荧光分析](#) [低能 \$\gamma\$ 散射](#) [镀、包层厚度](#)

分类号

DEFLUORINATION PROBLEM WITH THE CONVERTING PROCESS OF ADU TO UO₂ POWDER

Abstract

Key words

DOI

通讯作者

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [\[PDF全文\]\(301KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“X射线荧光分析”的相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)